

PFE500F

**TEST DATA
IEC61000 SERIES**

**テストデータ
IEC61000 シリーズ**

INDEX

	PAGE
1. イミュニティ試験結果サマリ Summary of Immunity Test Results	E-1
2. 静電気放電イミュニティ試験 Electrostatic discharge immunity test (IEC61000-4-2)	E-2
3. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験..... Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (IEC61000-4-3)	E-4
4. 電氣的ファーストトランジェントバーストイミュニティ試験 Electrical fast transient/burst immunity test (IEC61000-4-4)	E-6
5. サージイミュニティ試験 Surge immunity test (IEC61000-4-5)	E-8
6. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験 Conducted disturbances induced by radio-frequency field immunity test (IEC61000-4-6)	E-11
7. 電力周波数磁界イミュニティ試験 Power frequency magnetic field immunity test (IEC61000-4-8)	E-13
8. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験 Voltage dips,short interruptions immunity test (IEC61000-4-11)	E-15

※ 当社標準測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。

Test results are reference data based on our standard measurement condition.

1. イミュニティ試験結果サマリ Summary of Immunity Test Results

MODEL : PFE500F

項目 Item	規格 Standard	試験レベル Test Level	判定基準 Criterion Level	結果 Result
静電気放電イミュニティ試験 Electrostatic discharge immunity test	IEC61000-4-2	Contact Discharge : 5kV Air Discharge : 10kV	A	PASS
放射性無線周波数電磁界 イミュニティ試験 Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test	IEC61000-4-3	10V/m (80M-1000MHz)	A	PASS
電氣的ファーストトランジェント バーストイミュニティ試験 Electrical fast transient/burst immunity test	IEC61000-4-4	Input Port : 2kV	A	PASS
サージイミュニティ試験 Surge immunity test	IEC61000-4-5	Normal Mode : 2kV Common Mode : 4kV	A	PASS
伝導性無線周波数電磁界 イミュニティ試験 Conducted disturbances induced by radio- frequency field immunity test	IEC61000-4-6	10V (150k-80MHz)	A	PASS
電力周波数磁界イミュニティ試験 Power frequency magnetic field immunity test	IEC61000-4-8	30A/m (50Hz, 60Hz)	A	PASS
電圧ディップ、 瞬停イミュニティ試験 Voltage dips, short interruptions immunity test	IEC61000-4-11	DIP : 30%, 500ms	B	PASS
		DIP : 60%, 200ms		
		DIP : 100%, 20ms		
		DIP : 100%, 5000ms		

試験条件の詳細は、各テストページをご参照ください。
Refer to the test condition section for further details.

判定基準A

Criterion Level A

1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

判定基準B

Criterion Level B

1. 入力再投入を必要とする一時的な機能低下のない事
Must not have temporary function degradation that requires input restart.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

2. 静電気放電イミュニティ試験
Electrostatic discharge immunity test (IEC61000-4-2)

MODEL : PFE500F

(1) 使用計測器 Equipment Used

静電気試験器	: NSG435	(シャフナー)
Electrostatic Discharge Simulator		(SCHAFFNER)
放電抵抗	: 330 Ω	
Discharge Resistance		
静電容量	: 150pF	
Capacity		

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

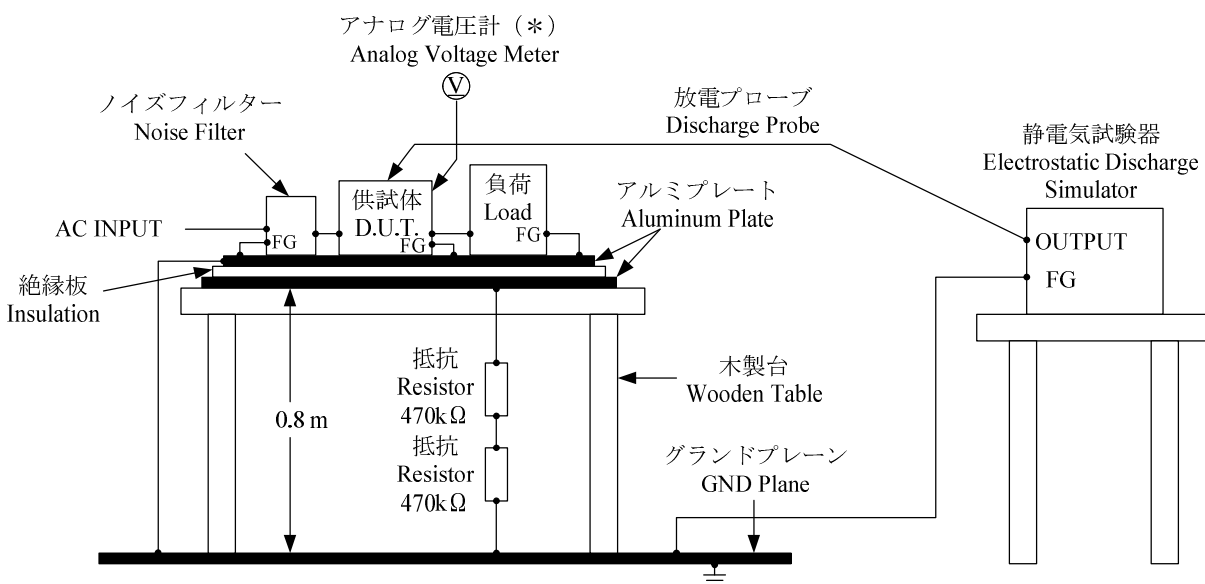
PFE500F-12	: 1 台 (unit)	PFE500F-48	: 1 台 (unit)
PFE500F-28	: 1 台 (unit)		

(3) 試験条件 Test Conditions

・ 入力電圧	: 100, 230VAC	・ 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・ 出力電流	: PFE500F-12 42A(100%)	・ 極性	: +, -
Output Current	PFE500F-28 18A(100%)	Polarity	
	PFE500F-48 10.5A(100%)	・ ベースプレート温度	: 25°C
		Base-Plate Temperature	
・ 試験回数	: 10回		
Number of Tests	10 times		
・ 放電間隔	: 1秒		
Discharge Interval	1 second		

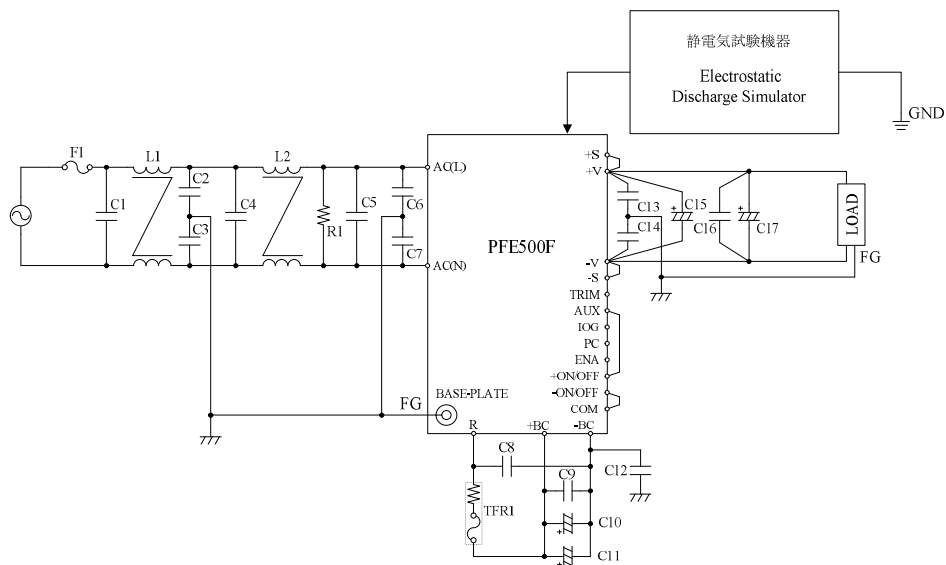
(4) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point

接触放電	: FG
Contact Discharge	
気中放電	: 入出力端子
Air Discharge	Input and Output Terminals



(*) オシロスコープが誤動作する為、アナログ電圧計を使用。
Analog Voltage Meter is used because Oscilloscope may malfunction.

(5) 試験回路 Test Circuit



- ・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5) : 250VAC 1 μ F
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2,C3,C6,C7,C12) : 250VAC 2200pF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C8,C9) : 450V 1 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C10,C11) : 450V 390 μ F
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C13,C14) : 250VAC 0.033 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C15,C17) : 12V : 25V 1000 μ F
Electrolytic Cap. : 28V : 50V 470 μ F
: 48V : 100V 220 μ F
- ・セラミックコンデンサ (C16) : 100V 2.2 μ F
Ceramic Cap.
- ・チョークコイル (L1,L2) : 6mH
Choke coil
- ・抵抗 (R1) : 0.5W 470k Ω
Resistor
- ・温度ヒューズ (TFR1) : 10 Ω 139 $^{\circ}$ C
Thermal fuse

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。
Output voltage regulation not to be exceed $\pm 5\%$ of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(7) 試験結果 Test Results

Test Method	Test Voltage	PFE500F-12	PFE500F-28	PFE500F-48
Contact	5kV (Level 2)	PASS	PASS	PASS
Air Discharge	10kV (Level 3)	PASS	PASS	PASS

3. 放射性無線周波数電磁界イミュニティ試験
Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test (IEC61000-4-3)

MODEL : PFE500F-48

(1) 使用計測器 Equipment Used

シグナルジェネレータ	Signal Generator	8648C (Hewlett Packard)
パワーアンプシステム	Power Amplifier System	AK500-200 (Kalmus)
パワーリフレクションメータ	Power Reflection Meter	NRT (Rohde & Schwarz)
パワーヘッド	Power Head	NAP-Z6 (Rohde&Schwarz)
バイログアンテナ	Bilog Antenna	CBL6140 (Chase)

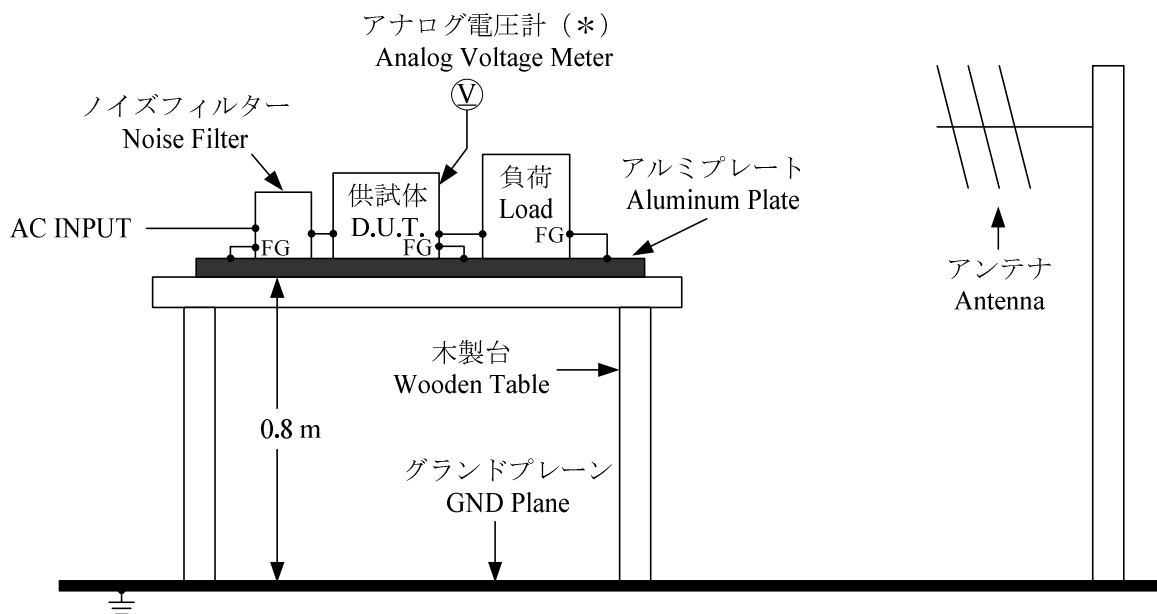
(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PFE500F-48 : 1台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

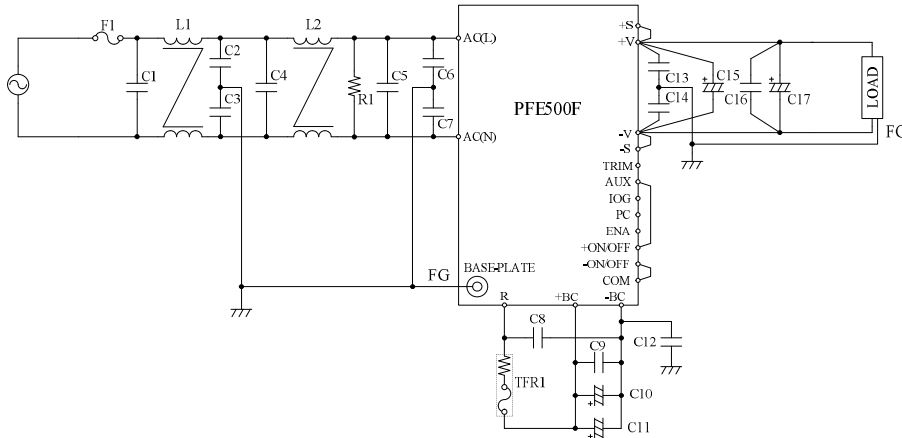
・ 入力電圧	: 100, 230VAC	・ 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・ 出力電流	: 10.5A(100%)	・ 振幅変調	: AM80%, 1kHz
Output Current		Amplitude Modulated	
・ 電磁界周波数	: 80M~1000MHz	・ ベースプレート温度	: 25°C
Electromagnetic Frequency		Base-Plate Temperature	
・ 距離	: 3m	・ 偏波	: 水平、垂直
Distance		Wave Angle	Horizontal and Vertical
・ スweep・コンディション	: 1.0%ステップ、3.0秒保持		
Sweep Conditions	1.0% Step Up, 3.0 seconds Hold		
・ 試験方向	: 上下、左右、前後		
Test Angle	Top/Bottom, Both Sides, Front/Back		

(4) 試験方法 Test Method



(*) オシロスコープが誤動作する為、アナログ電圧計を使用。
Analog Voltage Meter is used because Oscilloscope may malfunction.

(5) 試験回路 Test Circuit



- ・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5) : 250VAC 1 μ F
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2,C3,C6,C7,C12) : 250VAC 2200pF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C8,C9) : 450V 1 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C10,C11) : 450V 390 μ F
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C13,C14) : 250VAC 0.033 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C15,C17) : 100V 220 μ F
Electrolytic Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C16) : 100V 2.2 μ F
Ceramic Cap.
- ・チョークコイル (L1,L2) : 6mH
Choke coil
- ・抵抗 (R1) : 0.5W 470k Ω
Resistor
- ・温度ヒューズ (TFR1) : 10 Ω 139 $^{\circ}$ C
Thermal fuse

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。
Output voltage regulation not to be exceed $\pm 5\%$ of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(7) 試験結果 Test Results

Radiation Field Strength	PFE500F-48
10V/m (Level 3)	PASS

4. 電氣的ファーストトランジェントバーストイミュニティー試験 Electrical fast transient/burst immunity test (IEC61000-4-4)

MODEL : PFE500F

(1) 使用計測器 Equipment Used

EFT/B 発生器 : NSG-2025 (シャフナー)
EFT/B Generator (SCHAFFNER)

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

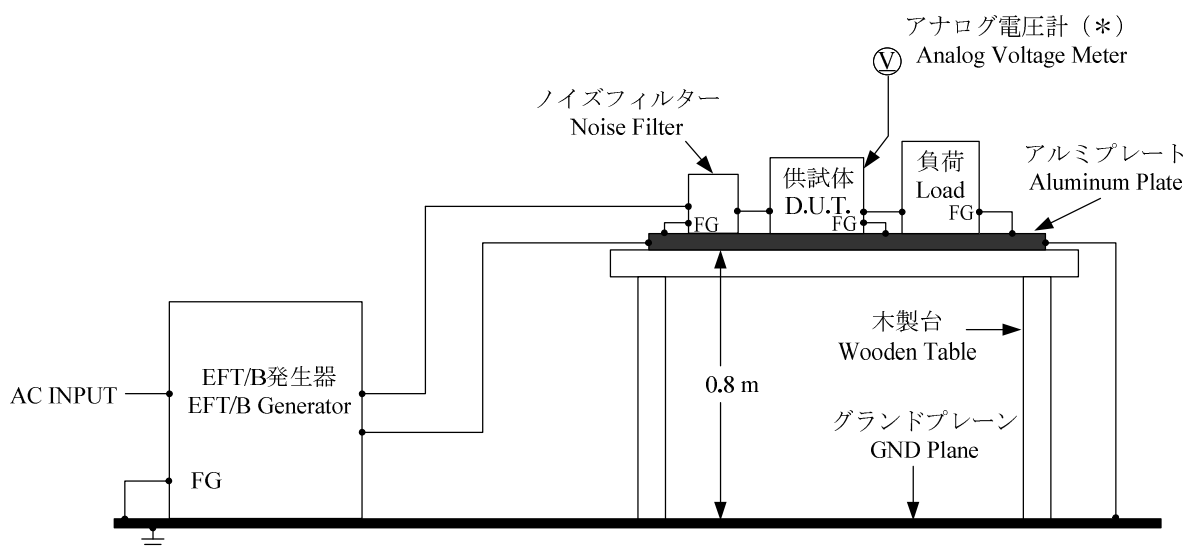
PFE500F-12 : 1 台 (unit) PFE500F-48 : 1 台 (unit)
PFE500F-28 : 1 台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

・ 入力電圧	: 100, 230VAC	・ 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・ 出力電流	: PFE500F-12 42A(100%)	・ 極性	: +, -
Output Current	PFE500F-28 18A(100%)	Polarity	
	PFE500F-48 10.5A(100%)	・ ベースプレート温度	: 25°C
・ 試験回数	: 3 回	Base-Plate Temperature	
Number of Tests	3 times		
・ 試験時間	: 1 分間		
Test Time	1 minute		

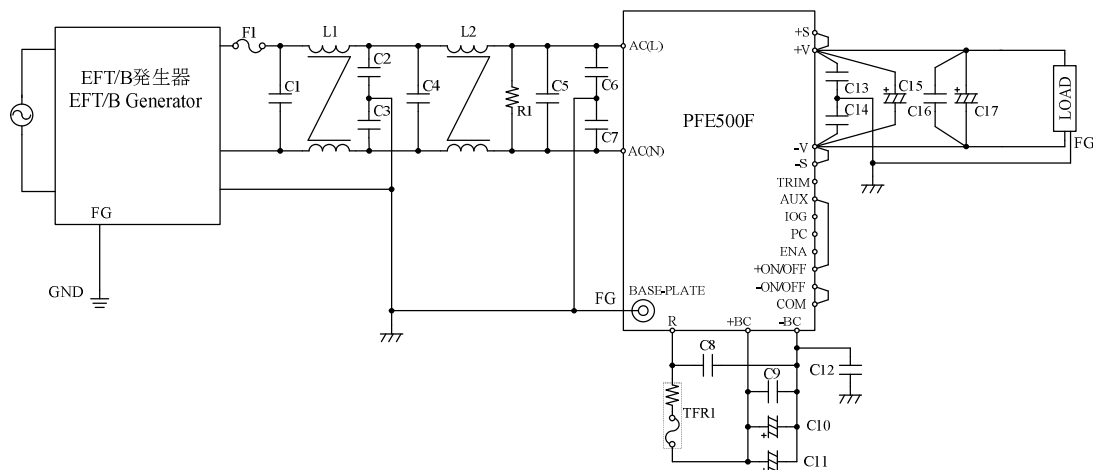
(4) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Points

N、L、FGに個別及び同時に印加
Apply to N, L, FG separately, as well as, all the same time.



(*)オシロスコープが誤動作する為、アナログ電圧計を使用。
Analog Voltage Meter is used because Oscilloscope may malfunction.

(5) 試験回路 Test Circuit



- ・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5) : 250VAC 1 μ F
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2,C3,C6,C7,C12) : 250VAC 2200pF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C8,C9) : 450V 1 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C10,C11) : 450V 390 μ F
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C13,C14) : 250VAC 0.033 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C15,C17) : 12V : 25V 1000 μ F
Electrolytic Cap. : 28V : 50V 470 μ F
: 48V : 100V 220 μ F
- ・セラミックコンデンサ (C16) : 100V 2.2 μ F
Ceramic Cap.
- ・チョークコイル (L1,L2) : 6mH
Choke coil
- ・抵抗 (R1) : 0.5W 470k Ω
Resistor
- ・温度ヒューズ (TFR1) : 10 Ω 139 $^{\circ}$ C
Thermal fuse

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。
Output voltage regulation not to be exceed $\pm 5\%$ of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(7) 試験結果 Test Results

Test Voltage	Repetition Rate	PFE500F-12	PFE500F-28	PFE500F-48
2kV (Level 3)	5kHz	PASS	PASS	PASS

5. サージイミュニティ試験
Surge immunity test (IEC61000-4-5)

MODEL : PFE500F

(1) 使用計測器 Equipment Used

サージ試験器	: LSS-15AX	(ノイズ研究所)
Surge Simulator		(Noise Laboratory)
結合インピーダンス	: コモン	12 Ω
Coupling Impedance	Common	
	: ノーマル	2 Ω
	Normal	
結合コンデンサ	: コモン	9 μ F
Coupling Capacitance	Common	
	: ノーマル	18 μ F
	Normal	

(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

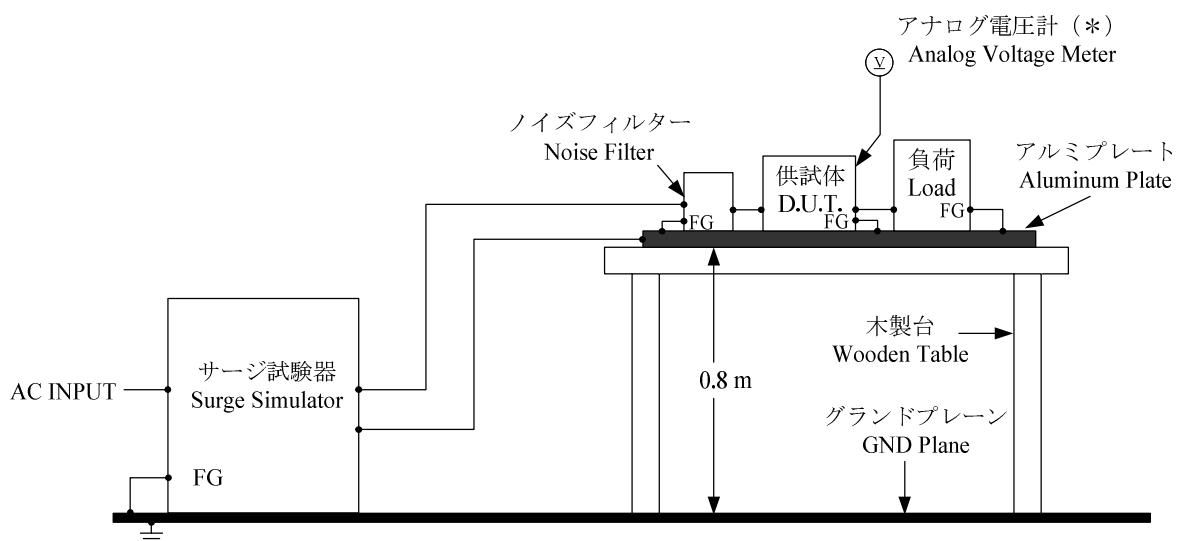
PFE500F-12	: 1 台 (unit)	PFE500F-48	: 1 台 (unit)
PFE500F-28	: 1 台 (unit)		

(3) 試験条件 Test Conditions

・ 入力電圧	: 100, 230VAC	・ 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・ 出力電流	: PFE500F-12 0A, 42A(100%)	・ 極性	: +, -
Output Current	PFE500F-28 0A, 18A(100%)	Polarity	
	PFE500F-48 0A, 10.5A(100%)	・ 位相	: 0, 90deg
・ 試験回数	: 3 回	Phase	
Number of Tests	3 times	・ ベースプレート温度	: 25°C
・ モード	: コモン、ノーマル	Base-Plate Temperature	
Mode	Common, Normal		

(4) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Points

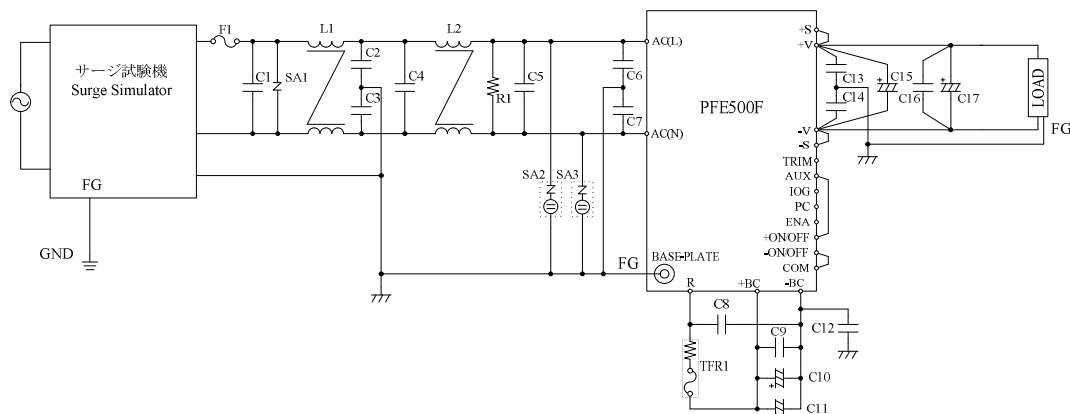
コモンモード (N-FG、L-FG) 及びノーマルモード (N-L) に印加
Apply to Common mode (N-FG, L-FG) and Normal mode (N-L)



(*) オシロスコープが誤動作する為、アナログ電圧計を使用。
Analog Voltage Meter is used because Oscilloscope may malfunction.

(5) 試験回路 Test Circuit

Application for COMMON:4kV (Level 4), NORMAL:2kV (Level 3)



- ・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5) : 250VAC 1 μ F
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2,C3,C6,C7,C12) : 250VAC 2200pF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C8,C9) : 450V 1 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C10,C11) : 450V 390 μ F
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C13,C14) : 250VAC 0.033 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C15,C17) : 12V : 25V 1000 μ F
Electrolytic Cap. : 28V : 50V 470 μ F
: 48V : 100V 220 μ F
- ・セラミックコンデンサ (C16) : 100V 2.2 μ F
Ceramic Cap.
- ・チョークコイル (L1,L2) : 6mH
Choke coil
- ・抵抗 (R1) : 0.5W 470k Ω
Resistor
- ・温度ヒューズ (TFR1) : 10 Ω 139 $^{\circ}$ C
Thermal fuse
- ・サージアブソーバ (SA1) : TND20SE471 (NIPPON CHEMI-COM)
Surge Absorber
- ・サージアブソーバ (SA2,SA3) : DSAZR2-302M (MITSUBISHI)
Surge Absorber

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

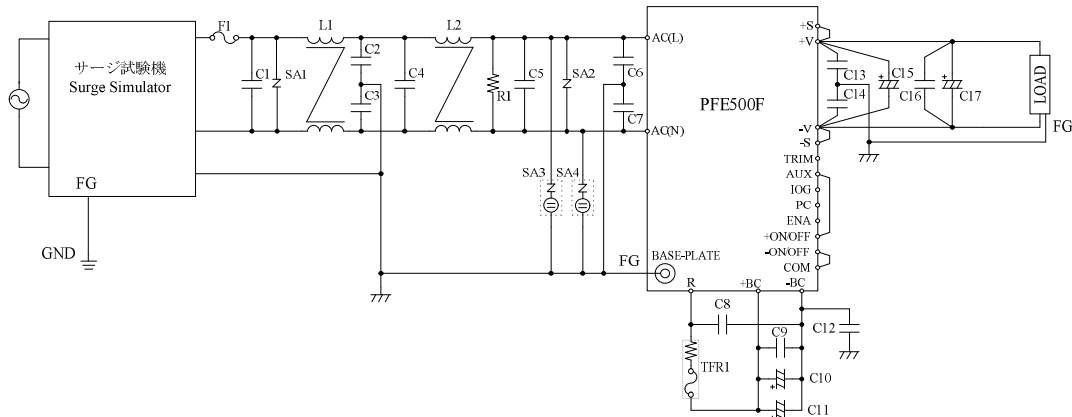
1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。
Output voltage regulation not to be exceed $\pm 5\%$ of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(7) 試験結果 Test Results

COMMON		NORMAL	
Test Voltage	Results	Test Voltage	Results
4kV (Level 4)	PASS	2kV (Level 3)	PASS

(8) 試験回路 Test Circuit

Application for COMMON:6kV (Level X), NORMAL:6kV (Level X)



- ・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5) : 250VAC 1 μ F
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2,C3,C6,C7,C12) : 250VAC 2200pF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C8,C9) : 450V 1 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C10,C11) : 450V 390 μ F
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C13,C14) : 250VAC 0.033 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C15,C17) : 12V : 25V 1000 μ F
Electrolytic Cap. : 28V : 50V 470 μ F
: 48V : 100V 220 μ F
- ・セラミックコンデンサ (C16) : 100V 2.2 μ F
Ceramic Cap.
- ・チョークコイル (L1,L2) : 6mH
Choke coil
- ・抵抗 (R1) : 0.5W 470k Ω
Resistor
- ・温度ヒューズ (TFR1) : 10 Ω 139 $^{\circ}$ C
Thermal fuse
- ・サージアブソーバ (SA1,SA2) : TND20SE471 (NIPPON CHEMI-COM)
Surge Absorber
- ・サージアブソーバ (SA3,SA4) : DSAZR2-302M (MITSUBISHI)
Surge Absorber

(9) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。
Output voltage regulation not to be exceed $\pm 5\%$ of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(10) 試験結果 Test Results

COMMON		NORMAL	
Test Voltage	Results	Test Voltage	Results
6kV (Level X)	PASS	6kV (Level X)	PASS

6. 伝導性無線周波数電磁界イミュニティ試験
 Conducted disturbances induced by radio-frequency field immunity test (IEC61000-4-6)

MODEL : PFE500F-48

(1) 使用計測器 Equipment Used

シグナルジェネレータ	Signal Generator	SMG (Rohde&Schwarz)
パワーアンプ	Power Amplifier	116FC (Kalmus)
アッテネータ	Attenuator	40-6-33 (Weinschel)
結合/減結合ネットワーク	Coupling De-coupling Network (CDN)	TCDN801-M2 (TOYO)
EMクランプ	EM Clamp	T/EM-801 (TOYO)

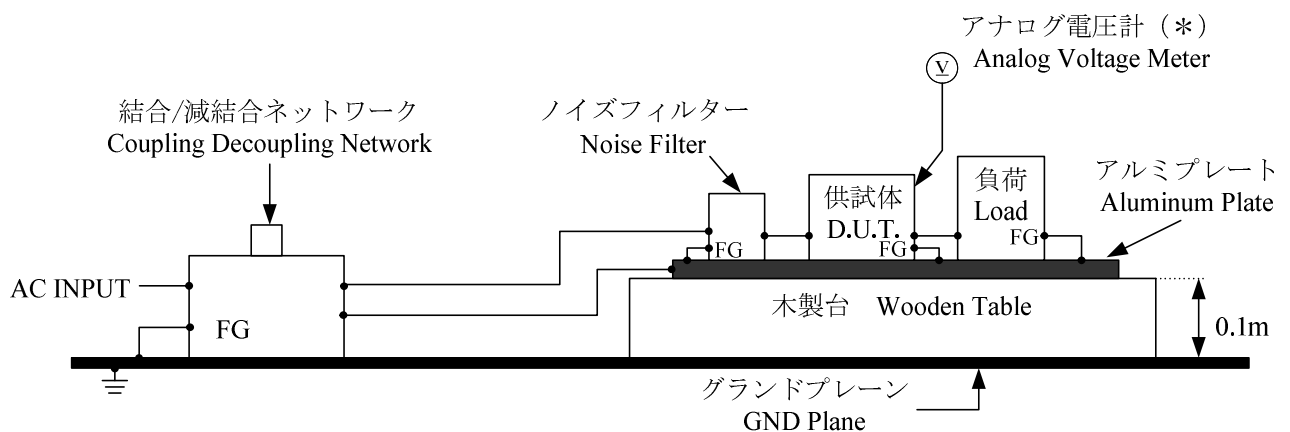
(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PFE500F-48 : 1台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

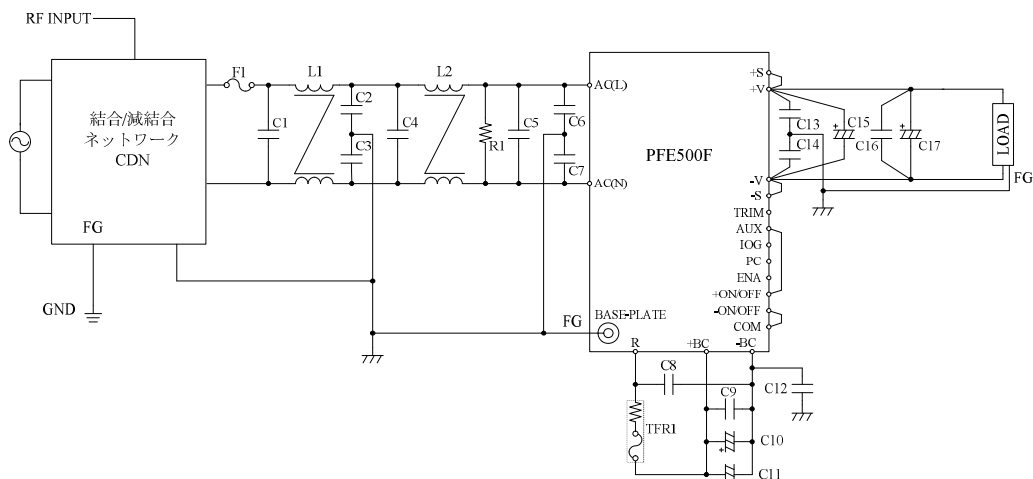
- ・ 入力電圧 : 100, 230VAC
 Input Voltage
- ・ 出力電圧 : 定格
 Output Voltage Rated
- ・ 出力電流 : 10.5A (100%)
 Output Current
- ・ 電磁界周波数 : 150kHz~80MHz
 Electromagnetic Frequency
- ・ スイープ・コンディション : 1.0%ステップ、1.0秒保持
 Sweep Conditions 1.0% Step Up, 1.0 Seconds Hold
- ・ ベースプレート温度 : 25°C
 Base-Plate Temperature

(4) 試験方法 Test Method



(*) オシロスコープが誤動作する為、アナログ電圧計を使用。
 Analog Voltage Meter is used because Oscilloscope may malfunction.

(5) 試験回路 Test Circuit



- ・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5) : 250VAC 1 μ F
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2,C3,C6,C7,C12) : 250VAC 2200pF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C8,C9) : 450V 1 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C10,C11) : 450V 390 μ F
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C13,C14) : 250VAC 0.033 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C15,C17) : 100V 220 μ F
Electrolytic Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C16) : 100V 2.2 μ F
Ceramic Cap.
- ・チョークコイル (L1,L2) : 6mH
Choke coil
- ・抵抗 (R1) : 0.5W 470k Ω
Resistor
- ・温度ヒューズ (TFR1) : 10 Ω 139 $^{\circ}$ C
Thermal fuse

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。
Output voltage regulation not to be exceed $\pm 5\%$ of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(7) 試験結果 Test Results

Test Voltage	PFE500F-48
10V (Level 3)	PASS

7. 電力周波数磁界イミュニティ試験
Power frequency magnetic field immunity test (IEC61000-4-8)

MODEL : PFE500F

(1) 使用計測器 Equipment Used

ACパワーソース : AA2000XG (高砂製作所)
AC Power Source (TAKASAGO)
ヘルムホルツコイル : HHS5215 (シュプーレン)
Helmholts Coil (Spulen)

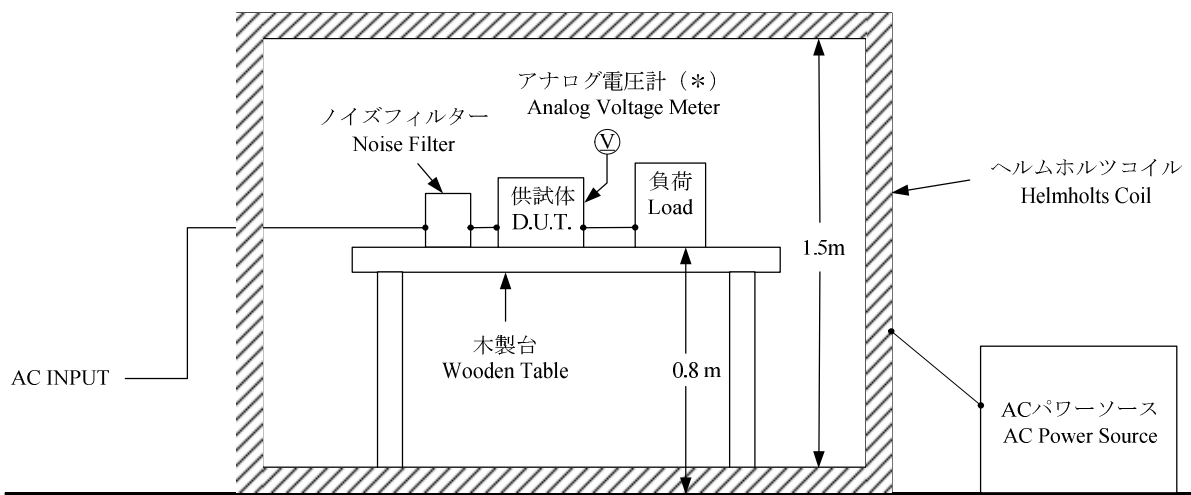
(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PFE500F-12 : 1台 (unit) PFE500F-48 : 1台 (unit)
PFE500F-28 : 1台 (unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

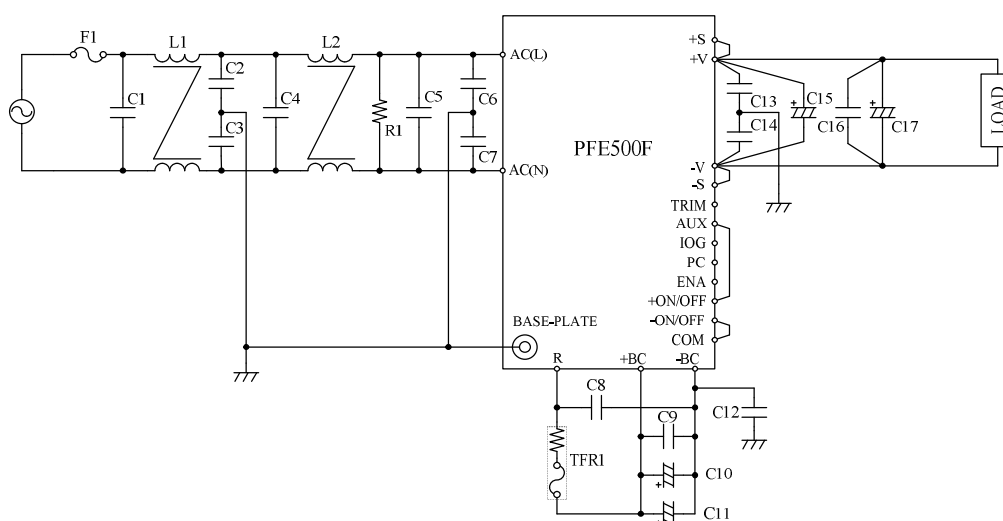
・入力電圧 : 100, 230VAC	・出力電圧 : 定格
Input Voltage	Output Voltage Rated
・出力電流 : PFE500F-12 42A(100%)	・ベースプレート温度 : 25°C
Output Current	Base-Plate Temperature
PFE500F-28 18A(100%)	・試験時間 : 10秒以上
PFE500F-48 10.5A(100%)	Test Time More than 10sec.
・印加磁界周波数 : 50Hz, 60Hz	
Magnetic Frequency	
・試験方向 : X, Y, Z	
Test Angle	

(4) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point



(*) オシロスコープが誤動作する為、アナログ電圧計を使用。
Analog Voltage Meter is used because Oscilloscope may malfunction.

(5) 試験回路 Test Circuit



- ・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5) : 250VAC 1 μ F
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2,C3,C6,C7,C12) : 250VAC 2200pF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C8,C9) : 450V 1 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C10,C11) : 450V 390 μ F
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C13,C14) : 250VAC 0.033 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C15,C17) : 12V : 25V 1000 μ F
Electrolytic Cap. : 28V : 50V 470 μ F
: 48V : 100V 220 μ F
- ・セラミックコンデンサ (C16) : 100V 2.2 μ F
Ceramic Cap.
- ・チョークコイル (L1,L2) : 6mH
Choke coil
- ・抵抗 (R1) : 0.5W 470k Ω
Resistor
- ・温度ヒューズ (TFR1) : 10 Ω 139 $^{\circ}$ C
Thermal fuse

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験中の出力電圧変動は初期値（試験前）の $\pm 5\%$ を限度とする事。
Output voltage regulation not to be exceed $\pm 5\%$ of initial (before test) value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
3. 1、2共に発煙／発火及び出力ダウンなき事。
No fire or smoke, as well as no output failure on the test.

(7) 試験結果 Test Results

Magnetic Field Strength	PFE500F-12	PFE500F-28	PFE500F-48
30A/m (Level 4)	PASS	PASS	PASS

8. 電圧ディップ、瞬停イミュニティ試験 Voltage dips, short interruptions immunity test (IEC61000-4-11)

MODEL : PFE500F

(1) 使用計測器 Equipment Used

試験発生器 : AA2000XG (高砂製作所)
Test Generator (TAKASAGO)

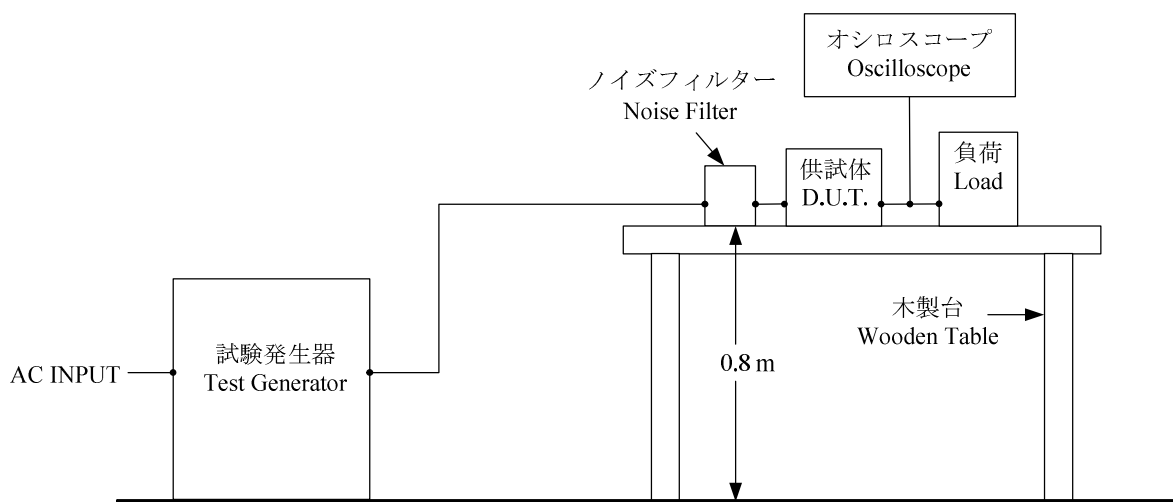
(2) 供試体台数 The Number of D.U.T. (Device Under Test)

PFE500F-12 : 1台 (unit) PFE500F-48 : 1台 (unit)
PFE500F-28 : 1台 (unit)

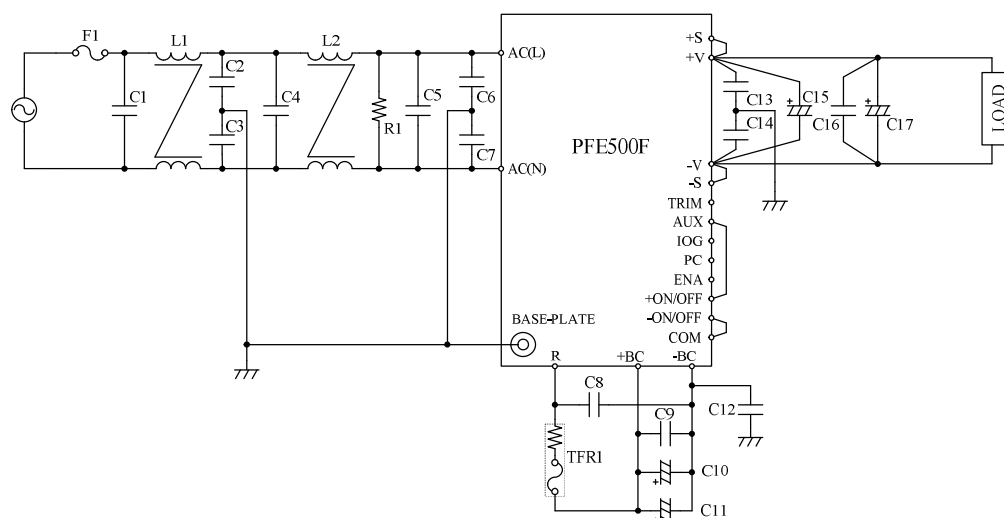
(3) 試験条件 Test Conditions

・ 入力電圧	: 100, 230VAC	・ 出力電圧	: 定格
Input Voltage		Output Voltage	Rated
・ 出力電流	: PFE500F-12 42A(100%)	・ ベースプレート温度	: 25°C
Output Current	PFE500F-28 18A(100%)	Base-Plate Temperature	
	PFE500F-48 10.5A(100%)	・ 試験間隔	: 10秒以上
・ 試験回数	: 3回	Test interval	More than 10sec.
Number of Tests	3 times		

(4) 試験方法及び印加箇所 Test Method and Device Test Point



(5) 試験回路 Test Circuit



- ・フィルムコンデンサ (C1,C4,C5) : 250VAC 1 μ F
Film Cap.
- ・セラミックコンデンサ (C2,C3,C6,C7,C12) : 250VAC 2200pF
Ceramic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C8,C9) : 450V 1 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C10,C11) : 450V 390 μ F
Electrolytic Cap.
- ・フィルムコンデンサ (C13,C14) : 250VAC 0.033 μ F
Film Cap.
- ・電解コンデンサ (C15,C17) : 12V : 25V 1000 μ F
Electrolytic Cap. : 28V : 50V 470 μ F
: 48V : 100V 220 μ F
- ・セラミックコンデンサ (C16) : 100V 2.2 μ F
Ceramic Cap.
- ・チョークコイル (L1,L2) : 6mH
Choke coil
- ・抵抗 (R1) : 0.5W 470k Ω
Resistor
- ・温度ヒューズ (TFR1) : 10 Ω 139 $^{\circ}$ C
Thermal fuse

(6) 判定条件 Acceptable Conditions

1. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事。
Output voltage to be within regulation specification after the test.
2. 発煙／発火及び出力ダウンなき事。
Smoke and fire do not occur.

(7) 試験結果 Test Results

Test Level(Class3)	Dip rate	Continue Time	PFE500F-12	PFE500F-28	PFE500F-48
70%	30%	500ms	PASS	PASS	PASS
40%	60%	200ms	PASS	PASS	PASS
0%	100%	10ms	PASS	PASS	PASS
0%	100%	20ms	PASS	PASS	PASS
0%	100%	5000ms	PASS	PASS	PASS